



(11) **EP 3 438 604 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
06.02.2019 Patentblatt 2019/06

(51) Int Cl.:
G01B 11/26 (2006.01) **G01B 11/00** (2006.01)
G02B 27/30 (2006.01) **G06T 7/66** (2017.01)
G06T 7/70 (2017.01)

(21) Anmeldenummer: **17184994.6**

(22) Anmeldetag: **04.08.2017**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA ME
Benannte Validierungsstaaten:
MA MD

(72) Erfinder:
• **Schumann, Matthias**
38104 Braunschweig (DE)
• **Geckeler, Ralf Dieter**
38116 Braunschweig (DE)

(71) Anmelder: **Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, endvertreten durch den Präsidenten der PTB 38116 Braunschweig (DE)**

(74) Vertreter: **Lins, Martina**
Gramm, Lins & Partner
Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB
Theodor-Heuss-Strasse 1
38122 Braunschweig (DE)

(54) **VERFAHREN ZUM ERMITTELN EINER LAGE EINES ZUMINDEST ABSCHNITTSWEISE LINIENFÖRMIGEN OBJEKTS UND VORRICHTUNG DAZU**

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ermitteln einer Lage eines zumindest abschnittsweise linienförmigen Objekts (26), mit dem Schritt Anordnen des Objekts (26), sodass auf dem Detektorelement (18) ein Messobjekt (24) abgebildet wird, wobei das Detektorelement (18) in N_x Zeilen (Z) und N_y Spalten (S) angeordnete Detektorpixel (Pi) aufweist, sich die Zeilen (Z) in eine Zeilenrichtung (Rz) erstrecken, zwei benachbarte Zeilen (Z) einen Zeilenabstand (d_y) haben, sich die Spalten (S) in eine quer, insbesondere senkrecht, zur Zeilenrichtung (Rz) verlaufende Spaltenrichtung (Rs) erstrecken, zwei benachbarte Spalten (S) einen Spaltenabstand (d_x) haben und zumindest so viele Spalten (S) wie Zeilen (Z) existieren, und wobei sich das Messobjekt (24) unter einem Orientierungswinkel (α) relativ zur Zeilen-

richtung (Rz) auf dem Detektorelement (18) erstreckt. Erfindungsgemäß gilt für den Orientierungswinkel (α) die

$$\text{Formel } \alpha = \arctan\left(\frac{n_y d_y}{n_x d_x}\right) \pm \varepsilon, \text{ wobei } n_x < N_x$$

und $n_y < N_y$ natürliche, teil-erfremde Zahlen sind und wobei $\varepsilon < 10$ Bogenminute gilt und dass das Verfahren die folgenden Schritte umfasst: (i) für jede relevante Pixellinie (S, Z) Bestimmen einer Position (M), insbesondere eines Schwerpunkts (M), des Messobjekts (24), wobei die Pixellinie eine Zeile oder eine Spalte ist, (ii) Mitteln der so erhaltenen Positionen (M) über n_{Px} Pixellinien, sodass Blockmittel-Lagen (L) erhalten werden und (iii) Bestimmen der Lage des Messobjekts (24) aus, insbesondere allen, Blockmittel-Lagen (L).

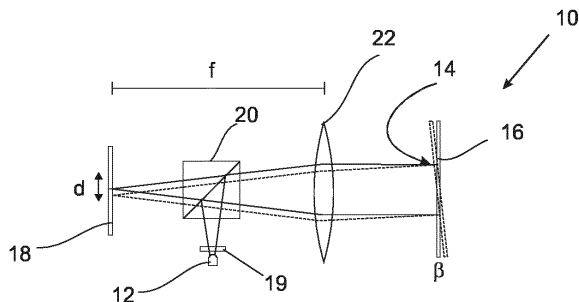


Fig. 1

EP 3 438 604 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ermitteln einer Lage eines zumindest abschnittsweise linienförmigen Objekts mit dem Schritt eines Anordnens des Objekts, sodass auf dem Detektorelement ein Messobjekt abgebildet wird, wobei das Detektorelement in N_x Zeilen und N_y Spalten angeordnete Detektorpixel aufweist, sich die Zeilen in eine Zeilenrichtung erstrecken, zwei benachbarte Zeilen einen Zeilenabstand haben, sich die Spalten in eine quer, insbesondere senkrecht, zur Zeilenrichtung verlaufende Spaltenrichtung erstrecken, zwei benachbarte Spalten einen Spaltenabstand haben und zumindest so viele Spalten wie Zeilen existieren und wobei sich das Messobjekt unter einem Orientierungswinkel in relativ zur Zeilenrichtung auf dem Detektorelement erstreckt.

[0002] Gemäß einem zweiten Aspekt betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zum Ermitteln einer Lage eines zumindest abschnittsweise linienförmigen Objekts mit (a) einer Objektaufnahme zum Aufnehmen des Objekts und (b) einem Detektorelement, das in N_x Zeilen und N_y Spalten angeordnete Detektorpixel aufweist, wobei $N_x \geq N_y$ gilt, wobei sich die Zeilen in eine Zeilenrichtung erstrecken, wobei zwei benachbarte Zeilen einen Zeilenabstand haben, wobei sich die Spalten in eine quer, insbesondere senkrecht, zur Zeilenrichtung verlaufende Spaltenrichtung erstrecken und wobei zwei benachbarte Spalten einen Spaltenabstand haben, wobei (c) das Objekt so angeordnet ist, dass es auf dem Detektorelement als Messobjekt abgebildet wird, wobei (d) sich das Messobjekt unter einem Orientierungswinkel relativ zur Zeilenrichtung auf dem Detektorelement erstreckt und (e) mit einer Auswerteeinheit, die mit dem Detektorelement verbunden ist.

[0003] Die Ermittlung der Lage zumindest abschnittsweise linienförmiger Objekte ist beispielsweise beim Betreiben von Autokollimatoren relevant. In diesem Fall ist das zumindest abschnittsweise linienförmige Objekt ein Teil einer Lichtquelle. Bewegt sich die Objektaufnahme, im vorliegenden Beispiel also der bewegliche Teil des Autokollimators, so bewegt sich das Messobjekt, das auch als Messmarkenbild bezeichnet werden könnte, auf dem Detektorelement. Die Positionsveränderung muss mit möglichst hoher Genauigkeit bestimmt werden, damit eine möglichst geringe Messunsicherheit erzielt werden kann. Ein zweites Beispiel für die Ermittlung einer Lage eines zumindest abschnittsweise linienförmigen Objekts ist die Positionsermittlung von Bauteilen auf einem Förderer, beispielsweise einem Bandförderer. Auch in diesem Fall ist eine möglichst hohe Genauigkeit bei der Bestimmung der Lage des Objekts wünschenswert.

[0004] Das linienförmige Objekt kann auch ein Muster sein, beispielsweise ein Interferogramm, ein Beugungsbild bei einer Lichtbeugung an einem Einzelspalt, eine Messmarke, ein Fadenkreuz oder eine Strichmarke.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das Ermitteln der Lage eines zumindest abschnittsweise linienförmigen Objekts zu verbessern.

[0006] Die Erfindung löst das Problem durch ein gattungsgemäßes Verfahren, bei dem für den Orientierungswinkel

α die Formel $\alpha = \arctan\left(\frac{n_y d_y}{n_x d_x}\right) \pm \varepsilon$ gilt, wobei $n_x < N_x$ und $n_y < N_y$ natürliche, teilerfremde Zahlen sind und wobei

$\varepsilon < 10$ Bogenminuten, vorzugsweise $\varepsilon < 7$ Bogenminuten, insbesondere $\varepsilon < 3$ Bogenminuten, gilt, wobei das Verfahren zudem die Schritte eines Bestimmens einer Position, insbesondere eines Schwerpunkts, des Messobjekts für jede relevante Pixellinie, wobei die Pixellinie eine Zeile oder eine Spalte ist, umfasst, wobei die so erhaltenen Lagen über n_{px} Pixellinien gemittelt werden, sodass N_{Bl} Blockmittel-Lagen erhalten werden und wobei die Lage des Messobjekts aus, insbesondere allen, Blockmittel-Lagen bestimmt wird.

[0007] Gemäß einem zweiten Aspekt löst die Erfindung das Problem durch eine gattungsgemäße Vorrichtung, bei der für den Orientierungswinkel die Formel $\alpha = \arctan\left(\frac{n_y d_y}{n_x d_x}\right) \pm \varepsilon$ gilt und bei der die Auswerteeinheit eingerichtet

ist zum auto-matischen Durchführen eines Verfahrens mit den Schritten: (i) für jede relevante Pixellinie Bestimmen einer Position, insbesondere eines Schwerpunkts, des Messobjekts, wobei die Pixellinie eine Zeile oder eine Spalte ist, (ii) Mitteln der so erhaltenen Lage über n_{px} Pixellinien, sodass N_{Bl} Blockmittel-Lagen erhalten werden, und Bestimmen der Lage des Messobjekts aus den Blockmittel-Lagen.

[0008] Vorteilhaft an dem Verfahren ist, dass die Lage des Messobjekts mit besonders geringer Messunsicherheit erfasst werden kann. Der Grund dafür ist, dass Pixeleffekte zum großen Teil eliminiert werden können. Die Licht-Intensitätsverteilung des Messobjekts, das auch als Messmarkenbild bezeichnet werden könnte, wird von einem CCD-Detektorelement unvollständig gemessen, da sie durch Pixel approximiert und damit verfälscht wird. Aus der gemessenen Licht-Intensitätsverteilung wird auf die Position der Intensitätsverteilung geschlossen, die damit ebenfalls verfälscht ist. Die Position von Strukturen mit Subpixel-Ausdehnung kann beispielsweise nur mit zusätzlichen Kenntnissen innerhalb eines Pixels bestimmt werden. Die aber liegen in der Regel nicht vor. Die Verfälschung durch die Pixelstruktur des Detektorelements führt zu einer systematischen Abweichung der bestimmten Position einer Lichtintensitätsverteilung gegenüber der tatsächlichen Position. Diese Abweichung wird Pixeleffekt genannt. Durch die erfindungsgemäße Lehre können Pixeleffekte ohne zusätzliche Kenntnisse theoretisch quasi vollständig ausgeglichen werden.

[0009] Vorteilhaft ist zudem, dass das erfindungsgemäße Verfahren ohne neuartige Bauteile auskommt und so mit

geringem Arbeitsaufwand bereits bestehende Vorrichtungen umgerüstet werden können.

[0010] Im Rahmen der folgenden Beschreibung wird unter dem Objekt ein realer Gegenstand verstanden wird, dessen Position ermittelt werden soll. Unter dem Messobjekt hingegen wird das Bild des Objekts auf dem Detektorelement verstanden. Aus der Lage des Messobjekts auf dem Detektorelement wird dann auf die Lage des Objekts geschlossen.

[0011] Unter einem zumindest abschnittsweise linienförmigen Objekt wird ein Objekt verstanden, das zumindest eine Kante hat, die durch eine Strecke beschrieben werden kann. Selbstverständlich kann prinzipiell jedes Objekt als Strecke beschrieben werden, solange ein beliebig großer Fehler, der durch diese Beschreibung verursacht wird, akzeptiert wird. Das aber ist nicht gemeint. Maßgeblich ist, dass durch die Beschreibung des Objekts als Linie höchstens eine zusätzliche Messunsicherheit bedingt wird, die höchstens das 0,8-fache der gesamten Messunsicherheit ausmacht. Insbesondere kann statt des Begriffs eines zumindest abschnittsweise linienförmigen Objekts der Begriff eines zunächst abschnittsweise quasieindimensionalen Objekts verwendet werden. Es sei darauf hingewiesen, dass es ausreichend ist, dass ein Teil des Messobjekts als linienförmig beschrieben werden kann. Beispielsweise ist auch ein gleichseitiges Dreieck in diesem Sinn ein abschnittsweise linienförmiges Objekt.

[0012] Vorzugsweise werden nur solche Pixellinien verwendet, deren Pixel innerhalb eines Auswertebereichs liegen, wobei das Objekt im Auswertebereich linienförmig ist. Insbesondere wird ein solches Objekt verwendet, für das eine Abweichung der Kanten des Messobjekts von einer (ideal geraden) Strecke im Auswertebereich höchstens einen Pixel, vorzugsweise höchstens ein halbes Pixel beträgt.

[0013] Unter dem Merkmal, dass eine Lage des Objekts beschrieben wird, wird insbesondere verstanden, dass die Lage relativ zu einer Ausgangs-Lage bestimmt wird. In anderen Worten ist das Bestimmen der Lage äquivalent zu dem Bestimmen einer Lageänderung.

[0014] Dass mehr Zeilen als Spalten existieren, soll lediglich die Benennung von Spalten und Zeilen vereinfachen. In anderen Worten bleibt ein Detektorelement gemäß Anspruch 1 ein solches Detektorelement, auch wenn es um 90° gedreht wird.

[0015] Unter einer relevanten Pixellinie wird eine Pixellinie verstanden, die das Messobjekt schneidet.

[0016] Günstig ist es, wenn die Detektorpixel quadratisch sind, das ist aber nicht notwendig. Wenn sie quadratisch sind, entspricht der Abstand d_y zweier Zeilen vorzugsweise dem Abstand d_x zweier Spalten. Insbesondere gilt $d_x = d_y \pm 5\%$.

[0017] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform beträgt eine Differenz zwischen n_x und n_y betragsmäßig höchstens 50, insbesondere höchstens 10, besonders bevorzugt höchstens zwei. Es lässt sich zeigen, dass in diesem Fall eine besonders geringe Messunsicherheit erreichbar ist.

[0018] Günstig ist es, wenn n_x höchstens $N_x/10$ beträgt. Anderenfalls ist der Bereich der Lagen, die erfasst werden können, vergleichsweise klein. Alternativ oder zusätzlich beträgt n_y höchstens $N_y/10$.

[0019] Günstig ist es, wenn die Zahlen n_{px} der Positionen, über die gemittelt wird, zumindest 5, insbesondere zumindest 20, beträgt. Je größer die Zahl der Pixellinien n_{px} ist, über die gemittelt wird, desto genauer kann die Lage ermittelt werden. Für praktische Anwendungen wird in der Regel ein Kompromiss zwischen einer möglichst geringen Messunsicherheit einerseits und einem großen Bereich an vermessbaren Positionen andererseits angestrebt.

[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform bewegt sich das Messobjekt so relativ zum Detektorelement, dass es sich stets innerhalb eines rechteckigen Detektionsbereichs befindet, wobei der Detektionsbereich $N_{x,D}$ Detektionsbereichs-Zeilen und $N_{y,D}$ Detektionsbereichs-Spalten hat und wobei N_x ein echter Teiler von $N_{x,D}$ ist und N_y ein Teiler von $N_{y,D}$ ist. In anderen Worten wird das Detektorelement oder eine Lage-Erfassungsvorrichtung, die das Detektorelement enthält, so ausgerichtet, dass das Objekt sich nur auf eine Art und Weise bewegen kann, dass das Messobjekt die genannte Anforderung erfüllt.

[0021] Günstig ist es, wenn die Pixellinie eine Spalte und $n_{px} = n_x$ ist, wenn $n_x > n_y$ gilt und dass die Pixellinie eine Zeile und $n_{py} = n_y$ ist, wenn $n_x < n_y$ gilt. So wird erreicht, dass stets über eine möglichst große Anzahl an Pixellinien gemittelt wird, was zu einer geringen Messunsicherheit führt.

[0022] Vorzugsweise umfasst das Verfahren die Schritte (i) Anordnen eines zweiten Objekts, sodass auf dem Detektorelement ein zweites Messobjekt abgebildet wird, das sich quer zum ersten Messobjekt erstreckt, (ii) für jede relevante Pixelquerlinie, die quer zu den Pixellinien verläuft, Bestimmen einer Position, insbesondere eines Schwerpunkts, des zweiten Messobjekts, (iii) Mitteln der so erhaltenen Lagen über N_{PL} , zwei Pixelquerlinien, sodass Zweitblockmittel-Lagen erhalten werden und (iv) Bestimmen der Lage des Messobjekts aus, insbesondere allen, Blockmittel-Lagen und, insbesondere allen, Zweitblockmittel-Lagen. Es ist prinzipiell nicht möglich, eine Verschiebung des Messobjekts und damit des Objekts in eine Richtung entlang dessen linienförmiger Erstreckung zu bestimmen. In Richtung quer, insbesondere senkrecht, dazu hingegen ergibt sich bei einer solchen Verschiebung die geringstmögliche Messunsicherheit. Durch das Anordnen von zwei Objekten, sodass zwei zueinander quer verlaufende Messobjekte entstehen, wird damit erreicht, dass jegliche Verschiebung der beiden Objekte mit höchstmöglicher Genauigkeit erfasst werden kann. Günstig ist es, wenn die beiden Objekte an ein und demselben Gegenstand ausgebildet sind. Beispielsweise bilden die beiden Objekte ein Fadenkreuz auf einem Gegenstand, dessen Lage zu vermessen ist.

[0023] Unter einer Pixelquerlinie wird eine Linie verstanden, die quer zu einer Pixellinie verläuft. Ist beispielsweise die

Pixellinie eine Zeile, so ist die Pixelquerlinie eine Spalte. Ist hingegen die Pixellinie eine Spalte, so ist die Pixelquerlinie eine Zeile.

[0024] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung ist vorzugsweise ein Autokollimator und weist eine Lichtquelle zum Ausenden eines Lichtstrahls und einen Reflektor zum Reflektieren des Lichtstrahls auf, wobei die Lichtquelle und der Reflektor so ausgebildet sind, dass der vom Reflektor reflektierte Lichtstrahl auf das Detektorelement fällt und dort das Messobjekt bildet. Auf diese Weise kann der Autokollimator mit einer besonders geringen Messunsicherheit betrieben werden.

[0025] Erfindungsgemäß ist insbesondere auch ein Autokollimator mit (a) einer Lichtquelle zum Erzeugen einer Messmarke, (b) einem Spiegel und (c) einem Detektorelement, das in N_x Zeilen und N_y Spalten angeordnete Detektorpixel aufweist, wobei $N_x \geq N_y$ gilt, wobei sich die Zeilen in eine Zeilenrichtung erstrecken, wobei zwei benachbarte Zeilen einen Zeilenabstand haben, wobei sich die Spalten in eine quer, insbesondere senkrecht, zur Zeilenrichtung verlaufende Spaltenrichtung erstrecken und wobei zwei benachbarte Spalten einen Spaltenabstand haben, (d) wobei die Lichtquelle und der Spiegel so angeordnet sind, dass die Messmarke auf dem Detektorelement als Messobjekt abgebildet wird, (e) wobei sich das Messobjekt unter einem Orientierungswinkel relativ zur Zeilenrichtung auf dem Detektorelement erstreckt, (f) einer Auswerteeinheit, die mit dem Detektorelement verbunden ist, wobei (g) für den Orientierungswinkel die Formel

$$\alpha = \arctan\left(\frac{n_y d_y}{n_x d_x}\right) \pm \varepsilon \text{ gilt, wobei } n_x < N_x \text{ und } n_y < N_y \text{ natürliche, teilerfremde Zahlen sind und wobei } \varepsilon < 10$$

Bogenminuten, vorzugsweise $\varepsilon < 7$ Bogenminuten, insbesondere $\varepsilon < 3$ Bogenminuten gilt, und (h) die Auswerteeinheit eingerichtet ist zum automatischen Durchführen eines Verfahrens mit den Schritten: (i) für jede relevante Pixellinie Bestimmen einer Position, insbesondere eines Schwerpunkts, des Messobjekts, wobei die Pixellinie eine Zeile oder eine Spalte ist, (ii) Mitteln der so erhaltenen Lagen über n_{px} Pixellinien, sodass Blockmittel-Lagen erhalten werden, und (iii) Bestimmen der Lage des Objekts aus, insbesondere allen, Blockmittel-Lagen.

[0026] Die Messmarke erstreckt sich abschnittsweise entlang einer ersten Linie. Vorzugsweise erstreckt sich die Messmarke zudem abschnittsweise entlang einer zweiten Linie, die quer, insbesondere senkrecht, zu ersten Linie verläuft.

[0027] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigt

Figur 1 eine erfindungsgemäße Vorrichtung in Form eines Autokollimators zum Durchführung eines erfindungsgemäßen Verfahrens,

Figur 2 eine schematische Ansicht des Messobjekts auf dem Detektorelement,

Figur 3a eine theoretische Berechnung der von verschiedenen Pixeln einer Zeile gemessenen Intensitäten,

Figur 3b die Abweichung der gemessenen Position von der tatsächlichen Position bei einer Auswertung nach dem Stand der Technik,

Figur 3c ein Diagramm, bei dem die gemessene Position über der tatsächlichen Position aufgetragen ist, wenn ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Auswertung verwendet wird,

Figur 3d eine Darstellung der Positionsabweichung über der tatsächlichen Position.

Figur 4a zeigt eine schematische Ansicht einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Ermitteln der Lage eines Objekts,

Figur 4b zeigt eine Ansicht von oben auf die Vorrichtung gemäß Figur 4a, und

Figur 5 zeigt eine schematische Ansicht eines ersten und eines zweiten Messobjekts auf dem Detektorelement.

Figur 6 zeigt eine weitere schematische Ansicht zur Erläuterung des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0028] Figur 1 zeigt schematisch eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum Mitteln einer Lage eines zumindest abschnittsweise linienförmigen Objekts in Form eines Autokollimators 10 mit einer Lichtquelle 12 zum Erzeugen einer Messmarke 14, die auf einen Spiegel 16 projiziert wird. Der Autokollimator 10 besitzt zudem ein Detektorelement 18 in Form eines CCD-Arrays. Licht von der Lichtquelle 12 durchläuft im vorliegenden Fall zunächst eine Schlitzblende 19 mit einem Schlitz in Form der Messmarke, einen Strahlteiler 20 und danach ein Objektiv 22. Das Objektiv 22 hat eine Brennweite f , die einem Abstand des Detektors 18 vom Objektiv 22 entspricht. Der Autokollimator 10 misst einen Winkel

β zwischen dem Spiegel 16 und dem Detektorelement 18 anhand einer Verschiebung d eines Bildes der Messmarke 14 auf dem Detektorelement 18.

[0029] Figur 2 zeigt schematisch das Detektorelement 18, das aus einer Vielzahl an Pixeln P_{ij} ($i = 1, 2, \dots, N_x$ und $j = 1, 2, \dots, N_y$) aufgebaut ist. Schematisch eingezeichnet ist ein Messobjekt 24, das das Abbild der Messmarke 14 ist. Es ist möglich, dass das Messobjekt 24 - wie im vorliegenden Fall - heller ist als die Umgebung, beispielsweise durch einen hellen Streifen gebildet ist. Umgekehrt ist es aber auch möglich, dass das Messobjekt 24 dunkler ist als die Umgebung und beispielsweise als schwarzer Strich gebildet ist und/oder dass das Messobjekt 24 ein einzelner Übergang von hell nach dunkel ist oder ein Übergang, der graduell ansteigend und wieder abnehmend ist.

[0030] Das Detektorelement 18 besitzt N_x Zeilen und N_y Spalten. Die Zeilenrichtung ist die x -Richtung und verläuft nach rechts. Die Spaltenrichtung ist die y -Richtung und verläuft nach oben. Der Zeilenabstand ist als d_y eingezeichnet, der Spaltenabstand als d_x . Der Zeilenabstand ist der Abstand der Mittelpunkte von zwei Pixeln gleicher Spalte und benachbarter Zeilen. Der Spaltenabstand ist der Abstand der Mittelpunkte von zwei Pixeln gleicher Zeile aber benachbarter Spalten.

[0031] Es ist zu erkennen, dass das Messobjekt 24 unter einem Orientierungswinkel α zum Detektorelement orientiert ist, für den im vorliegenden Fall $\alpha = \arctan\left(\frac{n_y d_y}{n_x d_x}\right) \pm \varepsilon$ mit $n_x = 7$ und $n_y = 6$ sowie $\varepsilon = 0$ gilt.

[0032] Ändert sich der Winkel β , so verschiebt sich das Messobjekt 24 und wird nun mit dem Bezugszeichen 24', gekennzeichnet. Zwischen diesen beiden Positionen befindet sich die Verschiebung d .

[0033] Da $n_x = 7 > 6 = n_y$ gilt, werden als Pixellinien Spalten und $n_{Px} = 7$ gewählt. Die relevanten Pixellinien sind in diesem Fall die Spalten S10, ..., S24, da das Messobjekt 24 diese Spalten kreuzt. Für jede der relevanten Pixellinien S10, ..., S24 wird der Schwerpunkt M des Messobjekts bestimmt. Es ergeben sich so die Schwerpunkte M10, M11, ..., M24.

[0034] In einem nachfolgendem Schritt werden die so erhaltenen Positionen M_K ($k = 1, \dots, 23$) über n_{Px} Pixellinien, im vorliegenden Fall $n_{Px} = n_x = 7$ Pixellinien, gemittelt, nämlich die Spalten S10 bis S16. Es wird daraus eine Blockmittel-Lage L ermittelt, die die Position des so ermittelten Mittelwerts in Einheiten des Detektorelements 18 angibt. Aus den nächsten $n_{Px} = 7$ Pixellinien S17 bis S23 wird eine zweite Blockmittel-Lage und L2 berechnet. Um die Darstellung zu vereinfachen werden lediglich die Blockmittel-Lagen L1 und L2 eingezeichnet. Die erste Blockmittel-Lage L1 wurde berechnet als Mittelwert der Schwerpunkte M10 bis M16. Die zweite Blockmittel-Lage L2 wurde berechnet aus den Positionen M17 bis M23.

[0035] Es sei darauf hingewiesen, dass das Detektorelement 18 in aller Regel deutlich mehr Pixel aufweist als in Figur 2 gezeigt. Zudem erstreckt sich das Messobjekt 24 über mehr Pixel. Aus diesem Grund existieren mehr Schwerpunkte M_K und damit mehr Blockmittel-Lagen L.

[0036] Aus der Gesamtheit der Blockmittel-Lagen L_K (hier: $K = 1, 2$) wird eine Gerade G1 berechnet. Verändert sich der Winkel β (vgl. Figur 1), so verschiebt sich die Gerade G1 um die Verschiebung d , sodass sich die Gerade G2 ergibt. Aus der so bestimmten Verschiebung d wird der Winkel β berechnet.

[0037] Figur 3a zeigt die Abhängigkeit der gemessenen Intensität I in beliebigen, beispielsweise normierten, Einheiten.

[0038] Figur 3b zeigt die daraus berechnete Positionsabweichung in Pixeln über der tatsächlichen Position in Pixeln. Gezeigt ist eine analytische Funktion, die in Anlehnung an die berechneten Positionen aus Fig. 3a willkürlich gewählt wurde, um die Funktionsweise des Verfahrens bildlich darzustellen. Die Funktion simuliert die Differenz zwischen berechneter und tatsächlicher Position des Messobjekts für jede einzelne Spalte. Aufgrund des Pixelrasters des Detektors ist dieser Zusammenhang immer periodisch mit 1 Pixel.

[0039] Figur 3c zeigt die gemessenen Positionen in Abhängigkeit von der tatsächlichen Position, wenn das erfindungsgemäße Verfahren angewendet wird.

[0040] Figur 3d zeigt die Positionsabweichung. Es ist zu erkennen, dass diese in Figur 3b gezeigte Positionsabweichung um den Faktor 10^{-3} kleiner ist. Positionsabweichungen sind die Abweichungen der berechneten Blockmittel-Lagen von den tatsächlichen Positionen. Hier sind simulierte Ergebnisse gezeigt, die die Funktionsweise des Verfahrens demonstrieren. Der Faktor 10^{-3} ist ein reines Simulationsergebnis und kann in realen Bedingungen anders sein. Die Periodizität der Abweichung der Blockmittel-Lagen eignet sich gut für eine quantitative Aussage. Die Periode TBI hängt mit der Anzahl der gemittelten Pixellinien zusammen, im Beispiel ist dies $TBI = 1/n_x = 1/7$ Px. Figur 4a zeigt eine zweite Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Ermitteln einer Lage eines Objekts 26, bei dem es sich beispielsweise um ein optisches Bauteil oder einen Wafer handeln kann. Dieses Objekt 26 ist auf einer Objektaufnahme 28 in Form einer Förderrichtung angeordnet. Eine Kamera 30, die das Detektorelement 18 umfasst, blickt auf das Objekt 26.

[0041] Figur 4b zeigt die Anordnung gemäß Figur 4a in einer Ansicht von oben. Die Lage des Objekts 26 wird wie oben beschrieben ermittelt. Dazu umfasst die Vorrichtung eine Auswerteeinheit 32, die mit dem Detektorelement 18 verbunden ist und automatisch das oben beschriebene Verfahren ausführt, sodass eine Position bezüglich eines vorgegebenen Koordinatensystems des Objekts 26 berechnet wird.

EP 3 438 604 A1

[0042] Das Objekt 26 kann eine schematisch eingezeichnete Messmarke 14 aufweisen, das ist aber nicht notwendig, solange das Objekt 26 selbst zumindest abschnittsweise linienförmig ist.

[0043] Figur 5 zeigt eine schematische Ansicht eines Bildes auf dem Detektorelement 18, wobei ein zweites Messobjekt 25 vorhanden ist, das sich quer, im vorliegenden Fall senkrecht, zum ersten Messobjekt 24 erstreckt. Das erste Messobjekt 24 und das zweite Messobjekt 25 bilden gemeinsam ein Messmarkenbild.

[0044] Figur 6 zeigt das Messobjekt 24, das sich innerhalb eines Beleuchtungsbereichs erstreckt. Der Beleuchtungsbereich umschließt das gesamte Messobjekt 24. Die Werte seiner Ausdehnungen $N_{x, BB}$, $N_{y, BB}$ sind nicht relevant und er kann größer sein als der Detektor. In Figur 6 sind die minimalen Ecken des Beleuchtungsbereiches gekennzeichnet. Verändert das Messobjekt 24 seine Lage, kann sich die Lage des Beleuchtungsbereichs verändern. Der Beleuchtungsbereich ist eine obere Grenze für die Wahl der Parameter, denn die Mittelung kann nur über Pixellinien durchgeführt werden, die das Messobjekt enthalten.

[0045] Der Auswertebereich B_A ergibt sich aus der Gesamtheit der ausgewählten Blöcke. Ein einzelner Block besteht aus n_x Spalten oder n_y Zeilen. Im Beispiel sind dies genau $n_x = 7$ Spalten. In Figur 6 sind drei mögliche Blöcke gekennzeichnet. Der Auswertebereich erstreckt sich dann über $N_{BI} \cdot n_x = 3 \cdot 7 = 21$ Spalten. In y-Richtung muss jeder Block vollständig innerhalb des Beleuchtungsbereichs und des Detektorelements liegen. Ändert das Messobjekt 24 seine Lage, ändert sich auch die Lage des Auswertebereichs, um die genannten Bedingungen immer zu erfüllen. Außerdem können adaptiv beliebige Blöcke von der Auswertung ausgeschlossen werden.

Bezugszeichenliste

| | | | | |
|----|----------|---------------------|-----------|---|
| 20 | 10 | Autokollimator | M | Schwerpunkt |
| | 12 | Lichtquelle | N_{BI} | Anzahl der Blöcke, über die gemittelt wird |
| | 14 | Messmarke | | |
| | 16 | Spiegel | n_{Px} | Zahl der Pixellinien pro Block, über die gemittelt wird |
| 25 | 18 | Detektorelement | | |
| | 19 | Schlitzblende | N_x | Zeilenanzahl |
| | | | N_y | Spaltenanzahl |
| | 20 | Strahlteiler | | |
| | 22 | Objektiv | $P_{i,j}$ | Pixel |
| 30 | 24 | Messobjekt | S | Spalte |
| | 25 | zweites Messobjekt | Z | Zeile |
| | 26 | Objekt | R_S | Spaltenrichtung |
| | 28 | Objektaufnahme | R_Z | Zeilenrichtung |
| 35 | 30 | Kamera | | |
| | 32 | Auswerteeinheit | | |
| | α | Orientierungswinkel | | |
| 40 | β | Winkel | | |
| | B_B | Beleuchtungsbereich | | |
| | d | Verschiebung | | |
| | D | Detektionsbereich | | |
| 45 | f | Brennweite | | |
| | G | Gerade | | |
| | i | Laufindex | | |
| | j | Laufindex | | |
| 50 | k | Laufindex | | |
| | L | Blockmittel-Lage | | |

Patentansprüche

1. Verfahren zum Ermitteln einer Lage eines zumindest abschnittsweise linienförmigen Objekts (26), mit dem Schritt

- (i) Anordnen des Objekts (26), sodass auf dem Detektorelement (18) ein Messobjekt (24) abgebildet wird,
 (ii) wobei das Detektorelement (18)

- in N_x Zeilen (Z) und N_y Spalten (S) angeordnete Detektorpixel (P_i) aufweist,
- sich die Zeilen (Z) in eine Zeilenrichtung (Rz) erstrecken,
- zwei benachbarte Zeilen (Z) einen Zeilenabstand (d_y) haben,
- sich die Spalten (S) in eine quer, insbesondere senkrecht, zur Zeilenrichtung (Rz) verlaufende Spaltenrichtung (Rs) erstrecken,
- zwei benachbarte Spalten (S) einen Spaltenabstand (d_x) haben und
- zumindest so viele Spalten (S) wie Zeilen (Z) existieren, und

- (iii) wobei sich das Messobjekt (24) unter einem Orientierungswinkel (α) relativ zur Zeilenrichtung (Rz) auf dem Detektorelement (18) erstreckt,

dadurch gekennzeichnet, dass

- (iv) für den Orientierungswinkel (α) die Formel $\alpha = \arctan \left(\frac{n_y d_y}{n_x d_x} \right) \pm \varepsilon$ gilt,

wobei $n_x < N_x$ und $n_y < N_y$ natürliche, teilerfremde Zahlen sind und

wobei $\varepsilon < 10$ Bogenminute gilt und dass das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

- (v) für jede relevante Pixellinie (S, Z) Bestimmen einer Position (M), insbesondere eines Schwerpunkts (M), des Messobjekts (24), wobei die Pixellinie eine Zeile oder eine Spalte ist,
- (vi) Mitteln der so erhaltenen Positionen (M) über n_{Px} Pixellinien, sodass Blockmittel-Lagen (L) erhalten werden und
- (vii) Bestimmen der Lage des Messobjekts (24) aus, insbesondere allen, Blockmittel-Lagen (L).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

- eine Differenz zwischen n_x und n_y betragsmäßig höchstens 50 beträgt, insbesondere höchstens 10 und/oder
- n_x höchstens $N_x/10$ beträgt und/oder n_y höchstens $N_y/10$ beträgt.

3. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass N_{Pi} zumindest 5, insbesondere zumindest 20, beträgt.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

- sich das Messobjekt (24) relativ zum Detektorelement (18) bewegt und stets innerhalb eines rechteckigen Detektionsbereichs (D) liegt,
- wobei der Detektionsbereich $N_{x,D}$ Detektionsbereichs-Zeilen und $N_{y,D}$ Detektionsbereich-Spalten hat und
- wobei n_x ein echter Teiler von $N_{x,D}$ und n_y ein Teiler von $N_{y,D}$ ist.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

- die Pixellinien Spalten sind und $n_{Px} = n_x$ ist, wenn $n_x > n_y$ gilt und
- die Pixellinien Zeilen sind und $n_{Px} = n_y$ ist, wenn $n_x < n_y$ gilt.

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die Schritte:

- (i) Anordnen eines zweiten Objekts (26), sodass auf dem Detektorelement (18) ein zweites Messobjekt (25) abgebildet wird, das sich quer zum ersten Messobjekt (24.1) erstreckt,
- (ii) für jede relevante Pixelquerlinie, die quer zu den Pixellinien verläuft, Bestimmen einer Position (M), insbesondere eines Schwerpunkts (M), des zweiten Messobjekts (24.2),
- (iii) Mitteln der so erhaltenen Lagen über $n_{Px,2}$ Pixelquerlinien, sodass Zweitblockmittel-Lagen erhalten werden und
- (iv) Bestimmen der Lage des Messobjekts (24) aus, insbesondere allen, Blockmittel-Lagen (L) und, insbesondere allen, Zweitblockmittel-Lagen.

7. Vorrichtung zum Ermitteln einer Lage eines zumindest abschnittsweise linienförmigen Objekts (26), mit

EP 3 438 604 A1

- (a) einer Objektaufnahme (28) zum Aufnehmen des Objekts (26) und
(b) einem Detektorelement (18), das

- 5
- in N_x Zeilen (Z) und N_y Spalten (S) angeordnete Detektorpixel (P_i) aufweist, wobei $N_x \geq N_y$ gilt,
- wobei sich die Zeilen (Z) in eine Zeilenrichtung (R_z) erstrecken,
- wobei zwei benachbarte Zeilen (Z) einen Zeilenabstand (d_y) haben,
- wobei sich die Spalten (S) in eine quer, insbesondere senkrecht, zur Zeilenrichtung (R_z) verlaufende Spaltenrichtung (R_s) erstrecken und
10
- wobei zwei benachbarte Spalten (S) einen Spaltenabstand (d_x) haben,

(c) wobei das Objekt so angeordnet ist, dass es auf dem Detektorelement (18) als Messobjekt (24) abgebildet wird,

(d) wobei sich das Messobjekt (24) unter einem Orientierungswinkel (α) relativ zur Zeilenrichtung (R_z) auf dem Detektorelement (18) erstreckt,

15
(e) einer Auswerteeinheit (32), die mit dem Detektorelement (18) verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

(f) für den Orientierungswinkel (α) die Formel $\alpha = \arctan\left(\frac{n_y d_y}{n_x d_x}\right) \pm \varepsilon$ gilt, gilt,

20
wobei $n_x < N_x$ und $n_y < N_y$ natürliche Zahlen sind und

wobei $\varepsilon < 10$ Bogenminute gilt, und

(g) die Auswerteeinheit (32) eingerichtet ist zum automatischen Durchführen eines Verfahrens mit den Schritten:

25
(i) für jede relevante Pixellinie (S, Z) Bestimmen einer Position (M), insbesondere eines Schwerpunkts (M), des Messobjekts (24), wobei die Pixellinie (S, Z) eine Zeile (Z) oder eine Spalte (S) ist,

(ii) Mitteln der so erhaltenen Lagen über n_{Px} Pixellinien, sodass Blockmittel-Lagen (L) erhalten werden, und

(iii) Bestimmen der Lage des Objekts (26) aus, insbesondere allen, Blockmittel-Lagen (L).

8. Autokollimator mit

30
(a) einer Lichtquelle (12) zum Erzeugen einer Messmarke (14),

(b) einem Spiegel (16) und

(c) einem Detektorelement (18), das

- 35
- in N_x Zeilen (Z) und N_y Spalten (S) angeordnete Detektorpixel (P_i) aufweist, wobei $N_x \geq N_y$ gilt,
- wobei sich die Zeilen (Z) in eine Zeilenrichtung (R_z) erstrecken,
- wobei zwei benachbarte Zeilen (Z) einen Zeilenabstand (d_y) haben,
- wobei sich die Spalten (S) in eine quer, insbesondere senkrecht, zur Zeilenrichtung (R_z) verlaufende Spaltenrichtung (R_s) erstrecken und
40
- wobei zwei benachbarte Spalten (S) einen Spaltenabstand (d_x) haben,

(d) wobei die Lichtquelle (12) und der Spiegel (16) so angeordnet sind, dass die Messmarke (14) auf dem Detektorelement (18) als Messobjekt (24) abgebildet wird,

(e) wobei sich das Messobjekt (24) unter einem Orientierungswinkel (α) relativ zur Zeilenrichtung (R_z) auf dem Detektorelement (18) erstreckt,

45
(f) einer Auswerteeinheit, die mit dem Detektorelement (18) verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

(g) für den Orientierungswinkel (α) die Formel $\alpha = \arctan\left(\frac{n_y d_y}{n_x d_x}\right) \pm \varepsilon$ gilt,

50
wobei $n_x < N_x$ und $n_y < N_y$ natürliche Zahlen sind und

wobei $\varepsilon < 10$ Bogenminute gilt, und

(h) die Auswerteeinheit eingerichtet ist zum automatischen Durchführen eines Verfahrens mit den Schritten:

55
(i) für jede relevante Pixellinie (S, Z) Bestimmen einer Position (M), insbesondere eines Schwerpunkts (M), des Messobjekts (24), wobei die Pixellinie (S, Z) eine Zeile (Z) oder eine Spalte (S) ist,

(ii) Mitteln der so erhaltenen Lagen über n_{Px} Pixellinien, sodass Blockmittel-Lagen (L) erhalten werden, und

(iii) Bestimmen der Lage des Objekts (26) aus, insbesondere allen, Blockmittel-Lagen (L).

9. Autokollimator nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet, dass**

(a) die Messmarke (14) sich abschnittsweise entlang einer ersten Linie erstreckt und sich abschnittsweise entlang einer zweiten Linie erstreckt, die quer, insbesondere senkrecht, zur ersten Linie verläuft und
5 (b) die Auswerteeinheit (32) eingerichtet ist zum automatischen Durchführen eines Verfahrens mit den Schritten

(i) für jede relevante Pixelquerlinie, die quer zu den Pixellinien verläuft, Bestimmen einer Position (M), insbesondere eines Schwerpunkts (M), des zweiten Messobjekts (24.2),

(ii) Mitteln der so erhaltenen Lagen über $n_{p_x,2}$ Pixelquerlinien, sodass Zweitblockmittel-Lagen erhalten werden und
10

(iii) Bestimmen der Lage des Messobjekts (24) aus, insbesondere allen, Blockmittel-Lagen (L) und, insbesondere allen, Zweitblockmittel-Lagen.
15

15

20

25

30

35

40

45

50

55

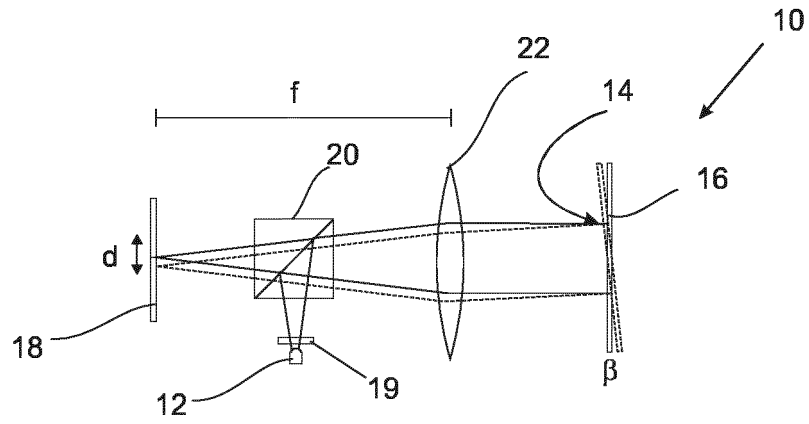


Fig. 1

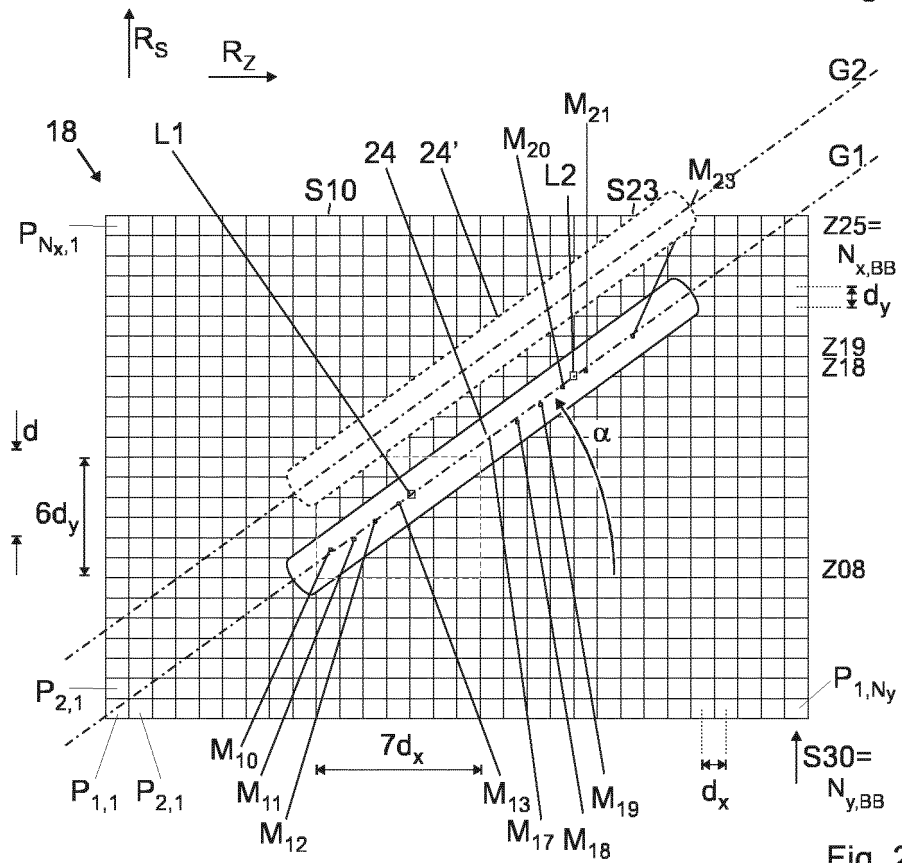


Fig. 2

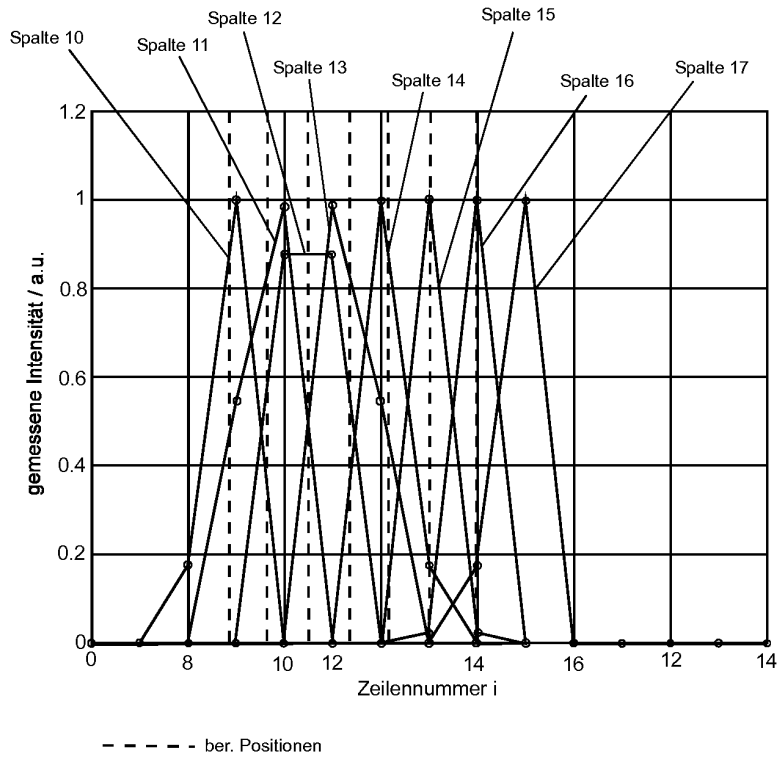


Fig. 3a

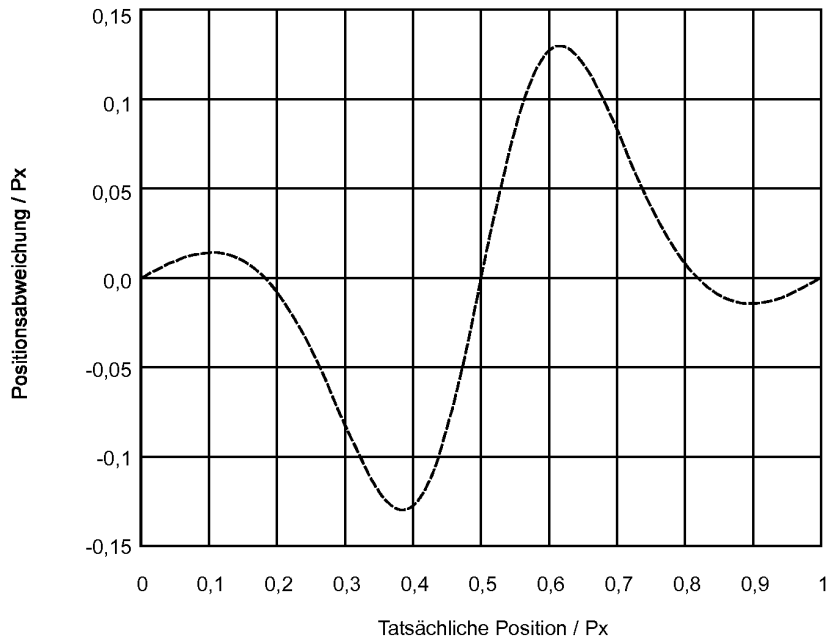


Fig. 3b

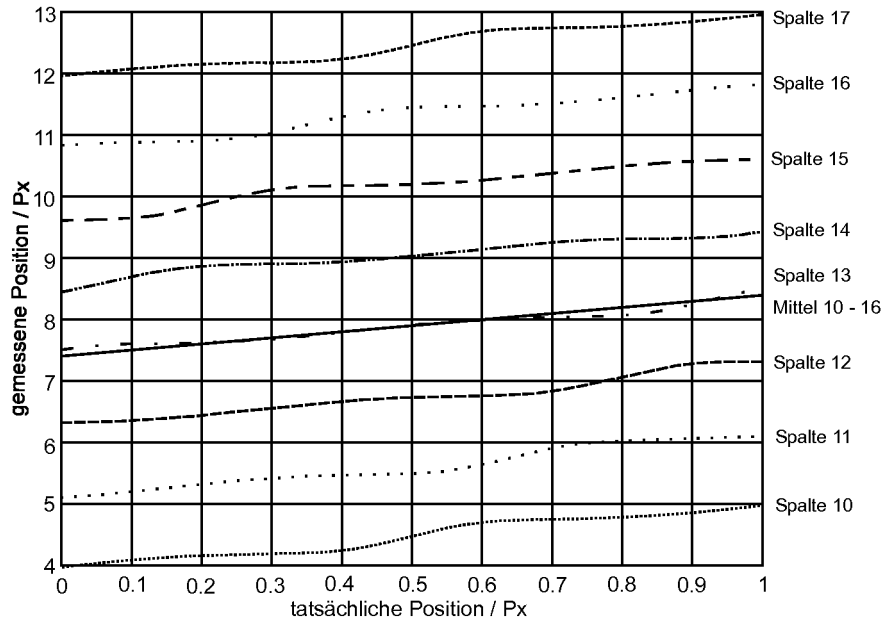


Fig. 3c

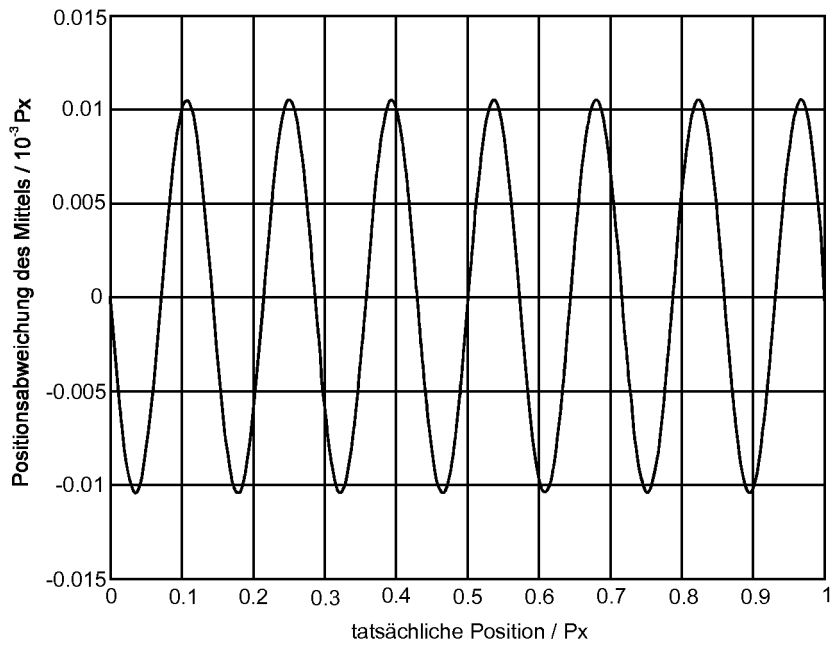


Fig. 3d

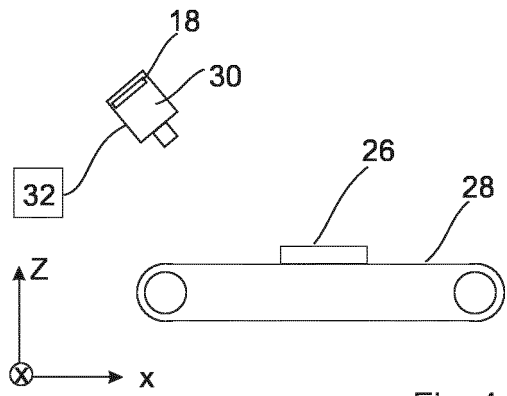


Fig. 4a

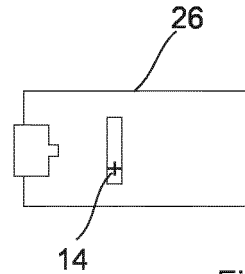


Fig. 4b

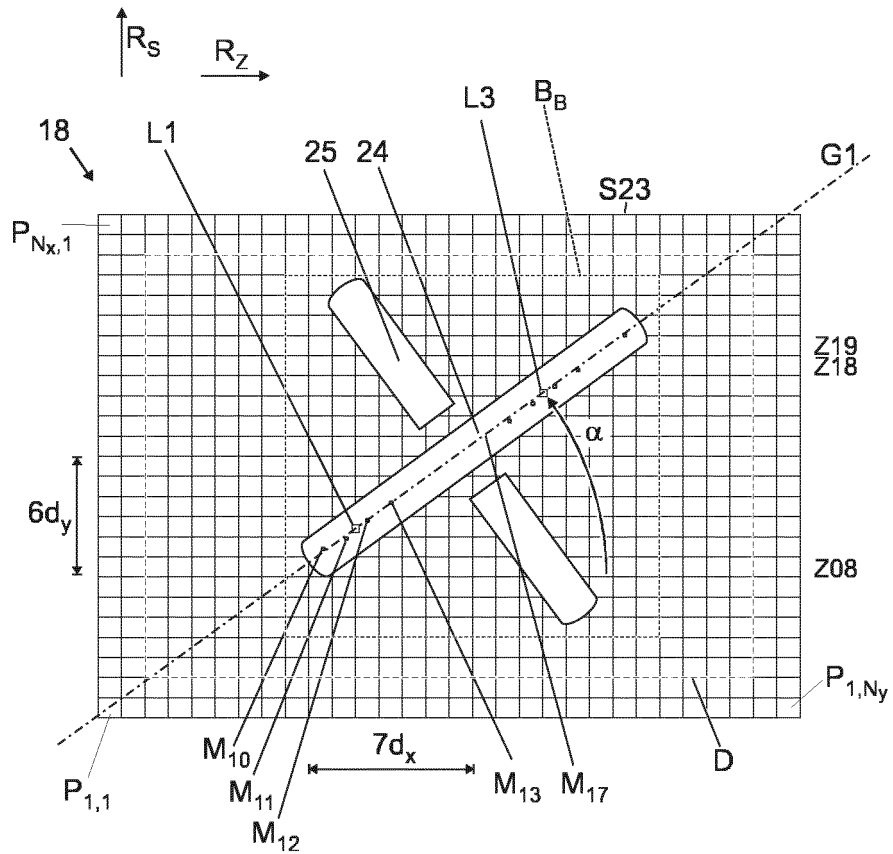


Fig. 5

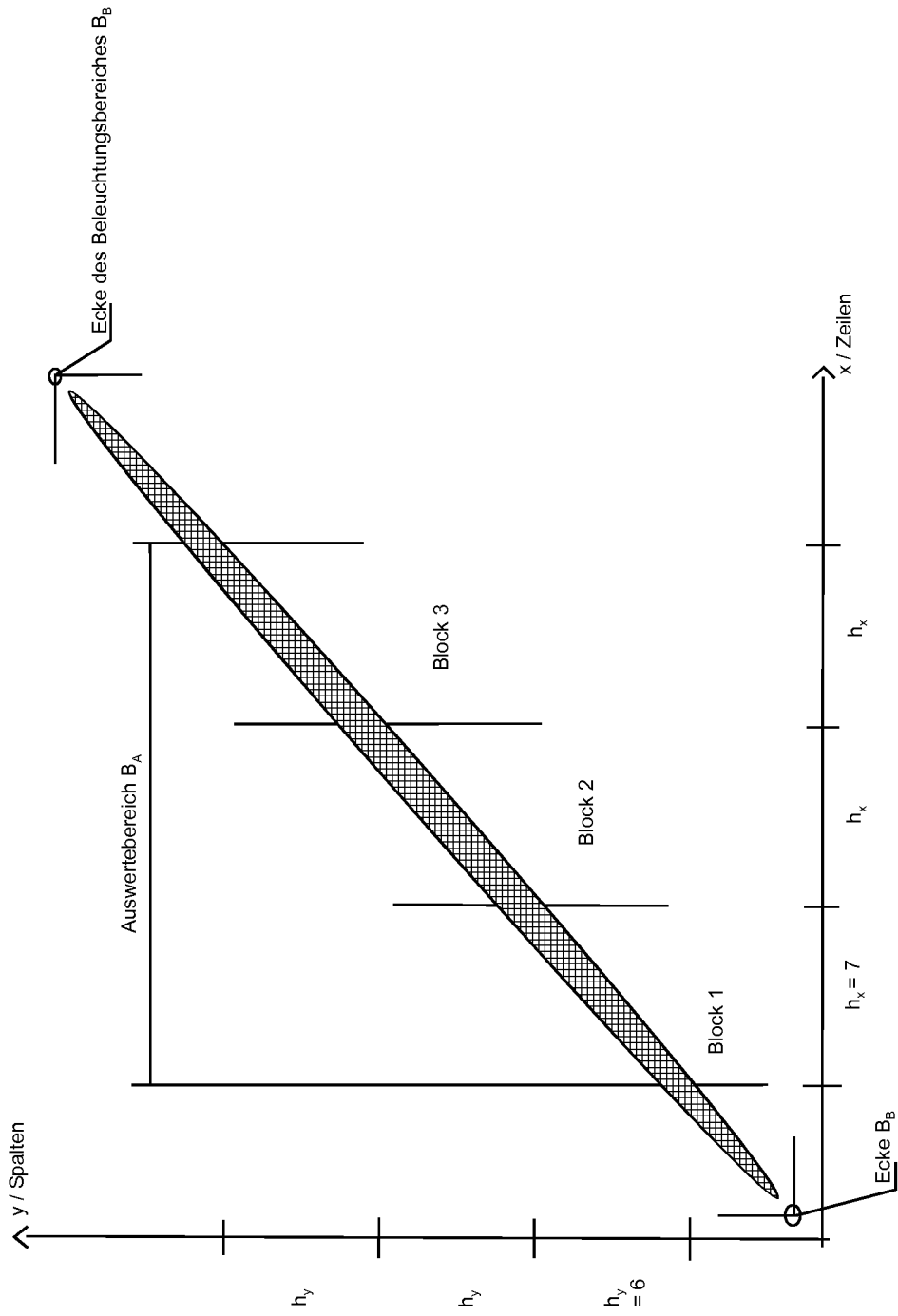


Fig. 6



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 17 18 4994

5

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE | | | |
|------------------------|---|--|---|
| Kategorie | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile | Betrifft Anspruch | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC) |
| 10 15 | X BERGUES GUILLERMO ET AL: "External visual interface for a Nikon 6D autocollimator", 2014 IEEE INTERNATIONAL INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT TECHNOLOGY CONFERENCE (I2MTC) PROCEEDINGS, IEEE, 12. Mai 2014 (2014-05-12), Seiten 35-39, XP032620797, DOI: 10.1109/I2MTC.2014.6860518 [gefunden am 2014-07-18] * das ganze Dokument * | 1-9 | INV. G01B11/26 G01B11/00 G02B27/30 G06T7/66 G06T7/70 |
| 20 | X JP 2003 166815 A (SHIBUYA KOGYO CO LTD) 13. Juni 2003 (2003-06-13) * Zusammenfassung * * Absatz [0012] - Absatz [0014]; Abbildungen 1-3 * | 1-7 8,9 | |
| 25 | A CN 102 901 459 A (NAT UNIV DEFENSE TECHNOLOGY) 30. Januar 2013 (2013-01-30) * Absatz [0137] - Absatz [0162]; Abbildungen 1-11 * * Absatz [0007] - Absatz [0136] * | 1-9 | RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC) |
| 30 | A JP 2009 014388 A (KOBE STEEL LTD) 22. Januar 2009 (2009-01-22) * Zusammenfassung * * Absatz [0020] - Absatz [0029]; Abbildungen 4-12 * | 1-9 | G01B G02B G01C G06T G06K |
| 35 | | -/-- | |
| 40 | Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt | | |
| 45 | Recherchenort München | Abschlußdatum der Recherche 15. Dezember 2017 | Prüfer Burkart, Johannes |
| 50 | KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur | | |
| 55 | T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument | | |

EPO FORM 1503 03 82 (P04C03)



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 17 18 4994

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE | | | |
|--|--|---|------------------------------------|
| Kategorie | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile | Betrifft Anspruch | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC) |
| A | <p>GECKELER R D ET AL: "Autocollimators for deflectometry: Current status and future progress", NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A: ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS, AND ASSOCIATED EQUIPMENT, ELSEVIER BV * NORTH-HOLLAND, NL, Bd. 616, Nr. 2-3, 1. Mai 2010 (2010-05-01), Seiten 140-146, XP027009568, ISSN: 0168-9002 [gefunden am 2009-11-12] * Abschnitte 3-5; Abbildungen 3-6 *</p> <p style="text-align: center;">-----</p> | 1-9 | |
| | | | RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC) |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt | | | |
| Recherchenort München | | Abschlußdatum der Recherche 15. Dezember 2017 | Prüfer Burkart, Johannes |
| <p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> | | <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument</p> <p>..... & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p> | |

EPO FORM 1503 03 82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 17 18 4994

5 In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten
 Patentdokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

15-12-2017

| Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument | Datum der Veröffentlichung | Mitglied(er) der Patentfamilie | Datum der Veröffentlichung |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| JP 2003166815 A | 13-06-2003 | JP 3759584 B2 JP 2003166815 A | 29-03-2006 13-06-2003 |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| CN 102901459 A | 30-01-2013 | KEINE | |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| JP 2009014388 A | 22-01-2009 | JP 4896828 B2 JP 2009014388 A | 14-03-2012 22-01-2009 |
| ----- | ----- | ----- | ----- |

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82